

SAICAS Application Note

斜め切削断面での化学分析測定 ① ～ FT-IR ～

資料番号:SC0003 / 公開日:2021.01.12

<概要>

化学分析技術によるイメージング測定を行う際に、試験体断面を評価するのではなく、斜め切削断面を測定することでより高分解能/高精度で深さ方向に連続して情報を得ることが可能となる。

そこで今回は、紫外線照射により劣化させたPC樹脂における深さ方向へのFT-IR分析事例を紹介する。

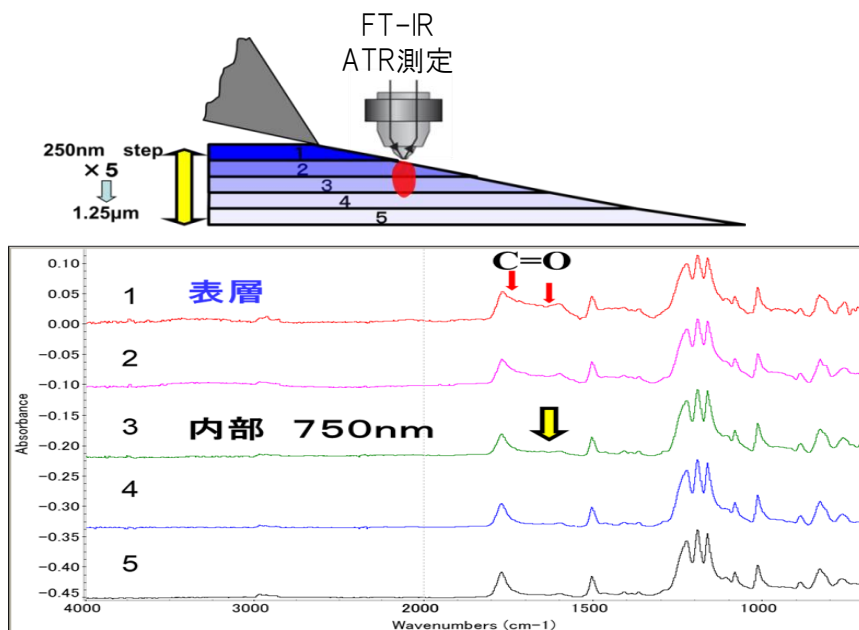
<試験>

試験体：ポリカーボネート(PC)樹脂 紫外線100h照射

試験装置：SAICAS NN-05型

切刃：ダイヤモンド切刃（刃幅0.3mmスクイ角40° ニゲ角10° C面）

<結果>



測定結果に関するお問い合わせは、dawin@wintes.co.jpまで



ダイプラ・ウィンテス株式会社
DAIPLA WINTES CO.,LTD.